长期存放的干涉滤光片的特性变化

干涉滤光片用在物理实验技术中,以及需要从连续谱(或线状谱)光源滤出固定波长的光通量的光学仪器制造业中。例如,在精密光度计ΦM-94中,利用干涉滤光片从钨灯连续辐射中分出某些激光波长的准单色光。当然,滤光片分出的光强最大值的波长,要保证恒定不变,众所周知,玻璃随着存放时间的推移,虽然程度不大,但毕竟改变了本身的光学和几何参数,这在用以制造标度尺或分度镜时是很重要的。

干涉膜系不具有结晶结构,象玻璃一样,是一个不稳定的热力学系统。问题发生了:干涉滤光片的性能可以稳定到什么程度?它们能否用于计量目的?我们存有大量滤光片,它们是在1943年~1945年镀制的,在实验室条件下一直保存到现在。

很自然,通过试验从这些样品材料得到全部可能的信息。可以说,就 滤 光 片 的 数 量 (1400)、复盖的波段 (350~1150nm) 和老化的持续时间 (约40年)来讲,都是独一无 二 的。滤光片的考察在于确定主通带和旁通带的波长,主通带的透过率和它的半宽度,并把实 测参量与初始数据相比较。

在 $n_x = n_{0x}$ 时,各层厚度偏离计算值对通带分裂的影响, 同样可以通过选取中心 层的特殊厚度加以完全消除,而在 $n_x \neq n_{0x}$ 时,选取相应的 α_x 值,可使 Δv 的减小比之 n_x 接近 n_{0x} 时更为剧烈。 α_x 值很容易从式(10)和(11)求得,其变化情景与图1的曲线4和 η 相类似。

如果通带分裂对滤光片光学特性的影响,在限定的入射角范围内必须消除,那么,只要改变中心层的厚度就足够了,它可使得对于给定的入射角,通带分裂为零[4]。图2绘出了关系α_x(θ)。这里我们仅仅指出,α_x按需要方向偏离于1,通带分裂在整个入射角范围内剧烈减小。

已分析的关系 $\Delta v(\theta)$ 和 $\alpha_x(\theta)$ 的特性,有可能根据实验样品的实测特性定性地判断滤光片 参量对计算值的偏离。在滤光片的镀制过程中,对各层膜的厚度监控如果没有大的失误,这对紧靠中心层的那些膜层是特别重要的[8],那么利用表示式(10)或(11), 根据 实际滤光片在倾斜一定角度时所测得的通带峰值位置,应该能够估计出系数 α_H , α_L 和 α_x 。

参 考 文 献(略)

详自 Опт. и спектр., 1985, Vol.58, No.3, P.681. 周密译 夏开校 在宣方圈 (图1) 上用点表示滤光 片 的数量, 这些滤光片的主通 带 显 示 出 某 种 正 的

或负的课移 Δλ (nm)。滤光片总数(1400)中有208块 (17%),其主通带位置保持在初始波长值附近±1nm范围内。其余83%的滤光片,主通带向长波或短波方向漂移,其范围为± (2~20) nm。虽然绝大多数 (83块)滤光片未表现出任何通带漂移,但是漂移的分布并不对应于随机误差的对称的高斯曲线。显然,在绝对漂移量相同时,长波漂移的机率大于短波漂移。

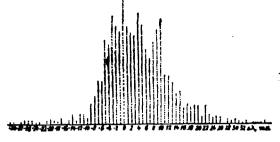


图1 滤光片按主通带初始波长值漂移量 分布的直方图

为了弄清概率漂移量的光谱分布,将全部滤光片按主通带的初始波长值、分为下列大组,350~450nm,450~500nm,500~550nm,550~650nm,650~750nm,750~1150nm。

	-	-
-	-	7
•	ж	- 1

波 疫 (nm)	中心波长 (nm)	滤光片数	平均課移(nm)
350~450	400	229	-2,17
450~500	4 75	212	+1.60
500~550	525	229	+4.46
550 ~ 650	600	303	+5.14
650~750	700	192	+5.21
750~1150	950	80	+4.21

对每组滤光片绘制了直方图(图2和图3)。现在很清楚, 在波段350~450nm, 虽然 漂移也往往向长波方面, 但是短波漂移的机率远远要大得多。 在波段450~500nm, 这种 趋势减弱, 而在波段500~550nm, 进一步变到相反的方面。

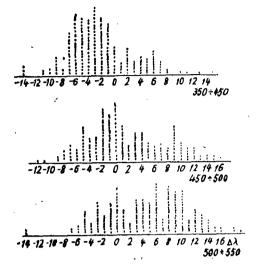
表 2

波 长 (nm)	滤光片总数	$\tau_{max}\Delta\lambda_{1/2}\uparrow$	$\tau_{\max}\Delta\lambda_{1/2}\downarrow$	$\tau_{msx}\Delta\lambda_1/2\uparrow$	τ _{msx} Δλ _{1/2} ↓
350~450	78	25	9	32	12
450~500	136	21	6	98	11
500~550	198	35	5	141	17
550~650	285	69	23	139	54
650~750	155	35	18	59	43
750 ~ 1150	74	5	2	44	23
滤光片数	926	190	63	513	160
占总数%	100	20.5	6.8	55 . 4	17.3

为了定量描述上述规律,计算了每一波段的平均漂移量,并与该波段的中心波长联系 起

来 (表1)。

为了弄清滤光片的通带形状变化特性,测量了透射率 τ_{max} 和半带宽 $\Delta \lambda_1/2$ 。 对于通带形状的变化,成功地研究了926块滤光片,因为其余的滤光片没有初始值 τ_{max} 和 $\Delta \lambda_1/2$ 的数据。



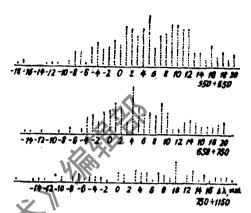


图 2、 3 各波段溢光片主通带波长漂移量分布的直方图

按特征变化将被考察的滤光片分为四组:

- 1)τ_{max}增大, 同时Δλ₁/2增大;
- 2)τ_=x增大, 而Δλ1/2减小;
- 3)τ_{max}减小,而Δλ1/2增大;
- 4)τ_{max}减小,同时Δλ1/2°减小

通带形状变化的测定结果列于表 2 。参量增大,用向上的箭头表示,参量减小,用向下箭头表示。

最经常遇到的通带形状变化,是 τ_{max} 减小,而 $\Delta\lambda_1/2$ 增大(占55.4%)。 较少的 情况是 τ_{max} 和 $\Delta\lambda_1/2$ 同时增加(20.5%)更少的情况是 $\Delta\lambda_1/2$ 减小(17.3%)。最后,最稀有的变化是 τ_{max} 增加和 $\Delta\lambda_1/2$ 减小(6.8%)。就象通带的漂移一样,从表 2 的数据,还看不出通 带 形状变化特性与波段的任何一种联系。第3~6行滤光片数量的系统变化,相应于第 2 行滤光片数量的同样变化。

阐明引起波长漂移和通带形状变化的过程,应是专门的研究课题。我们认为,从长时间存放在常规条件下的大量滤光片中得出的这一信息,向感兴趣的人们通报是必要的。从所得结果可以作出基本结论,用于计量学的干涉滤光片,会改变参量,因此应当定期校验。很有可能,参量的部分(甚至可能大部分)变化,就发生在所经历的40年中的头几年。

译自 OMI, 1985, No.11, P.42。 載尚峰 译 彭长华 栓

^{*}未指出某一参数未测定的情况,这种情况是相当少的。——原注